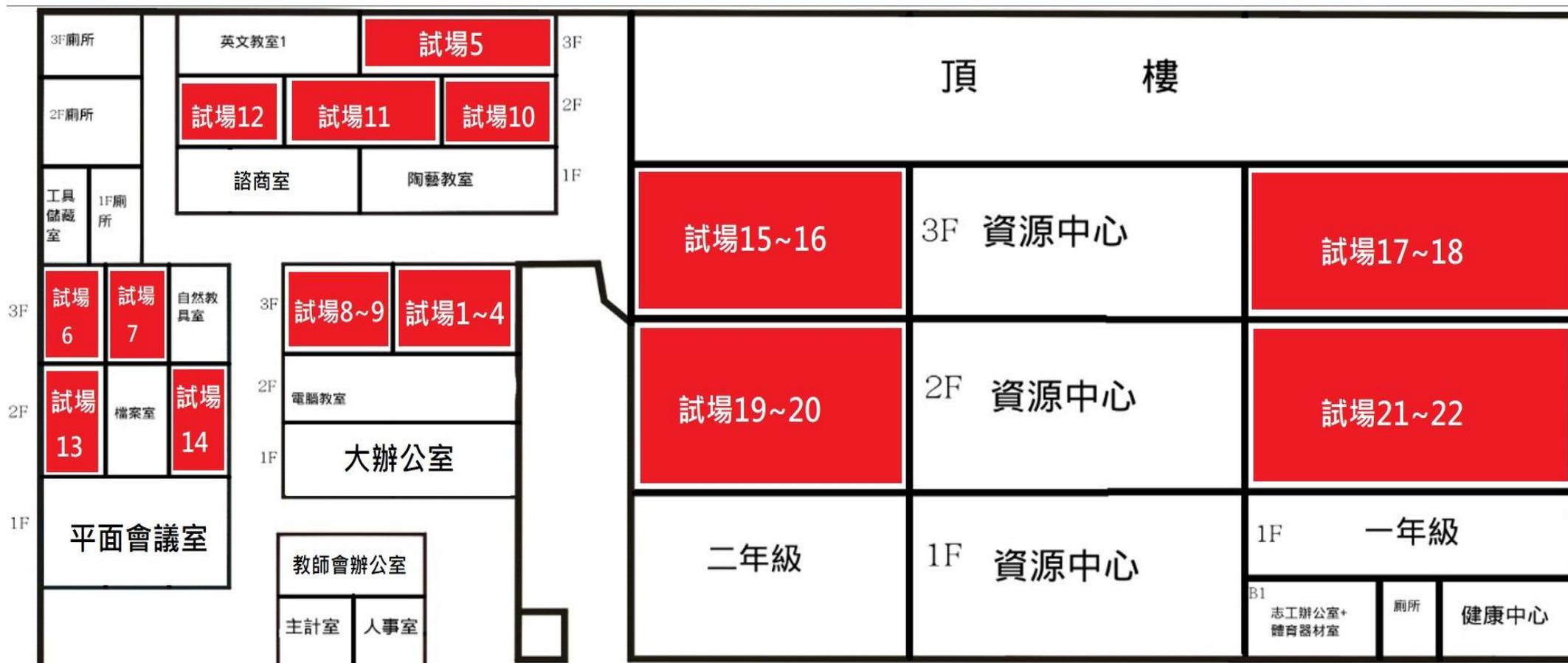


110 學年度深美國小 一般智能資優鑑定複選《試場分布圖》



110 學年度深美國小 一般智能資優鑑定複選《試場分配》

鑑定證編號	試場	鑑定證編號	試場
001	1	018	12
002	2	024	13
003	3	025	14
004	4	029	15
005	5	030	16
008	6	031	17
010	7	032	18
011	8	033	19
012	9	035	20
013	10	040	21
015	11	041	22